

# QT-50/5601TSR 四點探針面電阻值測試系統

四點探針面電阻值測試系統由5601TSR面電阻測試儀、QT-50手動測試控制台所組成。本系統利用四點探針原理測量出面電阻值/電阻係數；測量材質為晶圓或ITO膜等材料。

測量尺寸可為晶圓或方形尺寸；不用計算即可直接測量出面電阻值數值 $\Omega/\square$ 。系統體積小，重量輕，容易操作，具防靜電功能。可選配QT-60大尺寸手動測試控制台，QT-70自動探針測試台或ST-610A掌上型探頭進行測量。



QT-50 手動測試台 5601TSR 面電阻測試儀

## 應用

- 太陽能光電材料
- 導電高分子材料
- 透明導電薄膜材料
- ITO膜
- 奈米材料
- 小分子有機發光材料
- 高分子有機發光材料
- 生物晶片塗布材料



## QH-1026探針規格(軟針)

- 探針間距：1mm\*4
- 探針接觸電阻：150m $\Omega$
- 下針力道介於45g  $\pm$  20%之間
- 最大電流：1000mA
- 針頭：
  - 鍍銻處理 Sk4 High Carbon Steel
  - 圓頭：針頭 150 $\mu$ m
  - 尖頭：針頭<35 $\mu$ m；尖60°
- 重量：53g / 尺寸：25 x 40 x 40mm

## 功能特性

### 5601TSR面電阻測試儀

最大顯示	150000(表面電阻 $\Omega/\square$ ) / 33000(一般電阻 $\Omega$ )
取樣速率	4 samples/sec
顯示	六位數，7段LED(14.2mm)顯示
過載指示	"00000" 閃爍
量程選擇	自動和手動
過載保護	AC 330Vrms
工作電壓	AC90V~264V, 50/60Hz<15VA
操作溫度	0~50°C, RH $\leq$ 80%
通訊介面	RS232, RS485
串列傳輸速率	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
尺寸	208mm(長) x 91mm(高) x 280mm(寬)

### QT-50手動測試控制台

- 手動機台壓杆臂壓下定位功能，助於檢測
- 針頭壓力：外部加法碼改變壓力50g~500g
- 尺寸：300(長) x 250(寬) x 200(高)mm
- 量測尺寸：直徑150mm，(6inch晶圓)
- 重量：7kg

# QT-50/5601TSR 四點探針面電阻值測試系統

## 可提供各式探針台供選擇

### QT-60 手動測試台

- 晶圓尺寸：8"~12" (300mm)
- 方形尺寸：300mm x 300mm
- 尺寸：250(長) x 320(寬) x 170(高)mm

### ST-610A 掌上型探頭

- 掌上型，按下握把即可測量
- 針頭高低間距，輕鬆測量
- 尺寸：107mm(高)，直徑：52mm
- 重量：290g



ST-610A 掌上型探頭

### QT-SW 標準電阻 Simulate wafer

- 範圍：200m Ohm to 5K Ohm
- 可依客戶需求訂做任一阻值
- 精度：1%
- 標準片直徑：76mm
- 可由校準單位出據校準報告供追溯



## 5601TSR表面電阻量程

檔位	測試範圍	最小解析度	定電流輸出	準確度
1500.00mΩ/□	0.01m~1500.00mΩ/□	10μΩ/□	DC 100mA	±0.05%±20digit
15000.0mΩ/□	0.1m~15000.0mΩ/□	100μΩ/□	DC 100mA	
150.000Ω/□	0.001~150.000Ω/□	1mΩ/□	DC 100mA	±0.02%±10digit
1500.00Ω/□	0.01~1500.00Ω/□	10mΩ/□	DC 10mA	
15.0000KΩ/□	0.1~15.0000KΩ/□	100mΩ/□	DC 1mA	
150.000KΩ/□	0.001K~150.000KΩ/□	1Ω/□	DC 100μA	
1500.00KΩ/□	0.01K~1500.00KΩ/□	10Ω/□	DC 10μA	±0.05%±20digit
15000.0KΩ/□	0.1K~15000.0KΩ/□	100Ω/□	DC 1μA	
150.000MΩ/□	0.001M~150.000MΩ/□	1KΩ/□	DC 100nA	